

2026 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市ニデックパーク 33 番地 C 棟

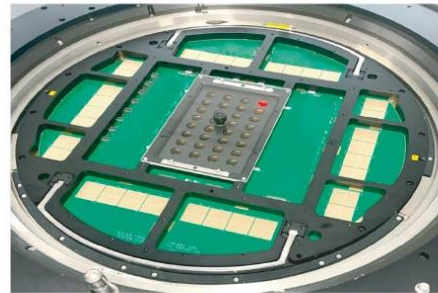
SEMICON KOREA 2026 出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2026 年 2 月 11 日(水)～2 月 13 日(金)に韓国・ソウル市 COEX コンベンションセンターで開催される「SEMICON KOREA 2026」に出展いたします。

本展示会では、次世代パワー半導体（IGBT/SiC）市場を支える検査装置「NATS シリーズ」をはじめ、グループの技術を結集した最新の検査ソリューションを展示いたします。



NATS-1304



2D MEMS プローブカード

当社子会社のニデック SV プローブからは、Wafer 検査用治具「プローブカード」の最新ソリューションとして、韓国では初出展となる半導体デバイスの温度測定が可能な TC（Thermo Couple）プローブや、2D MEMS 技術を用いたプローブカードなどをご紹介します。

ほかにも当社の核となる半導体パッケージ基板電気検査システム「GATS シリーズ」の最新モデルも展示予定です。

〈出展概要〉

- ・会期：2026 年 2 月 11 日(水)～2 月 13 日(金)
- ・会場：ソウル市 COEX コンベンションセンター
- ・ブース：1 階 Hall Grand Ballroom G004
- ・公式サイト：<https://www.semiconkorea.org/en>

〈出展及び Panel 展示内容〉

- | | |
|--|---------------------------------|
| ・2D-MEMS プローブカード | ・垂直型 高電流 PROBE |
| ・デバイス温度測定 PROBE | ・ガラスマイクロホール加工 |
| ・IGBT/SiC モジュール向け絶縁/静特性/動特性検査装置「NATS-1000/1700 シリーズ」 | |
| ・KGD テスト装置「NATS-1300 シリーズ」 | ・RWi-300MK(wafer AOI) |
| ・AC/DC マルチテスター「R-700 シリーズ」 | ・AI サーバー大型基板電気検査システム「GATS-8360」 |
| ・超高精度検査用ピンプローブ | |